电解工艺参数对铟微粉纯度和粒度的影响

王晓民¹,王志新¹,喇学伟¹,张廷安²

(1. 青海大学 青海省新型轻合金重点实验室,青海 西宁 810016)(2. 东北大学 多金属共生矿生态化冶金教育部重点实验室,辽宁 沈阳 110819)

摘 要:研究了电解工艺制备铟微粉时,铟离子浓度、电流密度和连续电解时间对粉体纯度和粒度的影响。结果表明: 当电解工艺参数为 NaCl 浓度 80 g/L,极距 5 cm,硫脲浓度 0.3 g/L,明胶浓度 0.5 g/L,pH=2.5,添加剂聚乙烯吡咯烷 酮用量为 0.2 g/L 时,连续电解时间越长,所得粉体粒度越大;电流密度为 130 A/m²时,所得粉体粒度最小,纯度最高; In³⁺浓度对粉体粒度的影响最小,但对纯度影响最大;在此工艺参数和 In³⁺浓度为 30 g/L,电流密度为 130 A/cm²的条件 下电解 1 h,可得到粒度小于 100 μm 的铟微粉,其中粒度小于 30 μm 的占 75%,粉体纯度为 99.9809%。

关键词: 铟微粉; 电解工艺参数; 粉体粒度; 粉体表征

中图法分类号:TG146.4⁺31 文献标识码:A

高纯铟粉在工业及生活中有广泛应用:如制备 ITO 靶材^[1,2]、III-V 族半导体材料^[3,4]、透明导电薄膜^[5]、电 池材料及核工业中铟合金的控制棒等^[6],而细铟粉(一 般<30 µm)主要用于制备 ITO 靶材、高纯合金、硅太 阳能电池背场铝浆(银浆、铝浆等),抗静电材料以及 其他电子行业产品等^[7]。铟粉的应用前景十分广阔。

铟粉的制备方法主要有真空雾化法^[8]和气相还原 法^[9]。真空雾化法可以根据需要制备不同粒度的粉体, 但是对铟的纯度要求较高,而且设备投资较大,成品率 低; 气相还原法制粉时, 对铟氧化物的纯度要求较高, 而且对铟氧化物的粒度要求也比较高,否则在还原过程 中易出现未反应核,导致粉体纯度降低。目前电解法主 要用于高纯铟的制备(通过电解产生海绵铟,然后重熔 铸锭),尚未应用到制备高纯铟粉体方面。其主要原因 是,在电解过程中,铟以枝晶状生长为主,导致海绵铟 产生,而不会产生粉体。通过加入聚乙烯吡咯烷酮来抑 制枝晶的生长^[10],从而可制备符合一定粒度要求的粉 体。即使电解过程中获得粒度过大的粉体,也可以作为 海绵铟重熔浇铸成锭,作为下一电解环节的电极来制备 纯度更高的粉体或高纯铟。本实验通过电解法制备出一 定粒度的粉体(小于30 µm),用于硅太阳能电池背场 铝浆,同时将粒度过大的粉体重熔浇注,又得到了纯度 较高的铟锭,实现了在同一操作环节中获得铟锭和铟粉 等多种工业产品,提高了工业附加值。可见,与真空雾 化和气相还原这两种制粉方法相比,电解法制粉更具有 文章编号: 1002-185X(2017)10-3151-05

优势。因此开展电解法制备铟微粉的研究具有重要的实际应用价值和理论意义。

影响电解制粉的工艺参数很多,包括铟离子浓度、 电流密度、连续电解时间、槽电压、极距、电解温度、 添加剂等。本工作着重研究铟离子浓度、电流密度和 连续电解时间3个因素对粉体纯度和粒度的影响,其 它因素的影响会在其它论文中加以阐述。

1 实 验

采用高纯钛板(18 mm×25 mm×5 mm)作阴极,纯 度为 99.9995%,青海聚能钛业有限公司生产。阳极采 用粗铟,切割成 18 mm×25 mm×5 mm,其纯度为 99.62%,其杂质含量见表 1,青海西部铟业有限公司 生产。

实验所用试剂如下:硫酸铟(99.99%),济宁市中 凯新型材料有限公司;氯化钠(GR),国药集团化学 试剂有限公司;硫脲(AR),天津市福晨化学试剂厂; 明胶(AR),天津市博迪化工股份有限公司;聚乙烯 吡咯烷酮(AR),天津市恒兴化学试剂制造有限公司。 去离子水(自制)。

实验采用自制有机玻璃电解槽,其结构如图1所示。槽电压为3V,电极极距5cm。采用HSPY-36-03 程控直流稳压电源(北京汉晟普源)进行电流密度调 节;采用驰久08-2G恒温磁力搅拌器(上海梅颖浦) 进行搅拌,加快传质速度。

基金项目:青海省科技厅科技促进计划(2014-ZJ-781)

收稿日期: 2016-09-30

作者简介: 王晓民, 男, 1975 年生, 博士, 副教授, 青海大学机械工程学院, 青海 西宁 810016, 电话: 0971-5310440, E-mail: ty.com.cn@126.com

表 1 铟锭杂质元素含量 Table 1 Impurity element content of indium ingot (ω/%)

			1 5			8 ()			
Pb	Cd	Sn	Zn	As	Al	Cu	Fe	Ti	Others
0.008	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.012

将一定质量的硫酸铟倒入烧杯中,加入稀硫酸和 去离子水,在磁力搅拌下至硫酸铟完全溶解,配制一 定浓度的硫酸铟溶液。之后加入一定量的 NaCl,硫脲, 明胶,聚乙烯吡咯烷酮等,配制满足要求的电解溶液, 并用稀硫酸调整溶液 pH 值。将配置好的溶液放到图 1 所示的电解装置中室温下进行组电解。电解一定时间 后,将已沉积铟的钛电极取出,并将沉积物刮在指定 容器内,待自然干燥后进行纯度及粒度分析。

电解原理如图 1 所示。其主要反应为: 阳极: In-3e=In³⁺; 阴极: In³⁺+3e=In

采用 JSM-6700F 扫描电子显微镜(日本电子)观 察粉体微观结构;用 Image-Pro-Plus(IPP)粒径分析 软件对粉体粒度分布进行表征;用 XRF-1800型 X 射 线荧光光谱仪(日本,岛津公司)对粉体杂质元素含 量进行分析。

2 结果与讨论

2.1 铟离子浓度对铟粉体纯度和粒度的影响

采用单因素实验。铟离子浓度分别取 10, 30, 50 g/L, 其余各物质浓度固定: NaCl 浓度为 80 g/L、电 流密度 130 A/m², 极距 5 cm, 硫脲浓度为 0.3 g/L、明 胶浓度为 0.5 g/L, pH=2.5, 电解时间 1 h。

表 2 列出了电解 1 h 后所得铟粉体中杂质元素的 含量。从表中可以看到,当铟离子浓度为 30 g/L 时所 得铟粉体纯度为 99.98%,较 99.62%的纯度提高了 0.36 个百分点,基本接近 4N 的纯度。

从表 2 中还可以发现,杂质元素在铟粉体中的含 量随着电解液中铟离子浓度的增加,基本呈现先减小



图 1 电解装置及原理

Fig.1 Electrolytic device and its principle

后升高的趋势。铟离子浓度低时,通过电解方式进入 溶液中的杂质离子浓度就会相应升高,从而在电解过 程中,增加了与铟一起沉积的机会;铟离子浓度过高, 铟离子沉积速度变大,会导致铟粉体粒度的增大(见 图 2c),从而裹挟一些杂质离子和铟离子一起沉积, 造成铟粉体中杂质元素含量增加。

从粉体的扫描电镜照片可以看出, 铟离子浓度为 30 g/L 时所得铟粉体粒度也最小, 但其均匀度略差(图 2b)。

粒度分析结果表明,当铟离子浓度为 30 g/L 时, 粉体粒度<30 μm 的占 75%,粒度具体分布如图 3 所 示。铟离子浓度过大时,铟沉积的速度大,分散性差, 从而导致粉体粒度变大。

2.2 电流密度对铟粉体纯度和粒度的影响

工艺参数如下: 铟离子浓度 30 g/L, NaCl 浓度为 80 g/L、极距 5 cm, 硫脲浓度为 0.3 g/L、明胶浓度为 0.5 g/L, pH=2.5, 电解时间 1 h。电流密度分别取 110, 130 和 150 A/m²。所得粉体杂质元素含量见表 3。可见, 电流密度在 130 A/m²时所获得的粉体纯度较高。电流 密度对杂质元素含量的影响不是很大, 但是 Tl、Cd 元素除外。随电流密度增加, Tl、Cd 元素与铟共沉积 的量也增大。因此在电解过程中,为了获得较高纯度 的铟粉,必须严格控制电流密度。有资料表明, 通过 预先纯化的方法, 可以有效减少 Tl、Cd 元素与铟的共 沉积, 提高铟粉纯度^[11]。

图 4, 图 5 分别给出了不同电流密度下所得粉体 的扫描电镜照片以及不同电流密度下粉体粒度分布。 可以看出,电流密度过大,粉体形成及沉积速度过快,

	表 2	不同 In ³	⁰*浓度下锻	粉中杂质元	素含量	
Table 2	Imp	urity eler	ment conte	ent of indium	powder	under

different In ³⁺ concentrations (µg·g ⁻¹)						
Flomont	In^{3+} concentration/g L ⁻¹					
Element	10	30	50			
Cu	36	10	41			
Fe	52	10	26			
Zn	34	6	33			
Tl	167	35	74			
Pb	153	11	46			
Cd	203	32	68			
Sn	164	21	83			
As	85	19	75			
Al	95	8	81			
Others	311	39	74			
In powder purity/%	99.87	99.98	99.94			



图 2 不同铟离子浓度下铟粉微观形貌

Fig.2 SEM images of In powder under different In³⁺ concentrations: (a) 10 g/L, (b) 30 g/L, and (c) 50 g/L



Fig.3 Particle size distribution of indium powder under different In^{3+} concentrations

different current densities (µg·g ⁻¹)					
Flowert	Current density/A m ⁻²				
Element	110	130	150		
Cu	39	10	32		
Fe	21	10	39		
Zn	26	6	35		
Tl	29	35	123		
Pb	38	11	47		
Cd	30	32	119		
Sn	87	21	69		
As	23	19	17		
Al	34	8	21		
Others	253	39	205		
In powder purity/%	99.94	99.98	99.93		

表 3 不同电流密度下铟粉中杂质元素含量 Table 3 Impurity element content of indium powder under





Fig.4 SEM images of In powder under different current densities: (a) 110 A/m², (b) 130 A/m², and (c) 150 A/m²

导致粉体粒度过大; 电流密度过小, 虽然可以获得粒度比较均匀的粉体, 但粒度相对较大; 当电流密度为 130 A/m²时, 虽然粒度分布不是很均匀, 但此时粉体 粒度最小。

2.3 连续电解时间对铟粉体纯度和粒度的影响

工艺参数如下: 铟离子浓度 30 g/L, NaCl 浓度 为 80 g/L, 电流密度 130 A/m², 极距 5 cm, 硫脲浓 度为 0.3 g/L, 明胶浓度为 0.5 g/L, pH=2.5, 连续电 解时间分别取 1, 3 和 5 h。所得粉体杂质元素含量见 表 4。 从表 4 数据可以看出,随着连续电解时间的延长, 通过电解后进入电解液中的杂质元素含量也随之增加,为其与铟共沉积创造了条件,所以粉体中杂质含 量明显增加。图 6 和图 7 分别给出了不同连续电解时 间所得粉体的扫描电镜照片以及粉体粒度分布。可见 当连续电解 1 h 时,所得粉体粒度最小。随着连续电 解时间的延长,所得粉体的粒度逐渐增大。其原因是 随着电解时间的延长,晶核有了充分的时间长大,导 致粉体粒度增加。





表 4 不同连续电解时间下铟粉中杂质元素含量 Table 4 Impurity element content of indium powder with different continuous electrolysis time (ug.g⁻¹)

different continuous electrolysis time (µg·g)						
Flowert	Electrolysis time/h					
Element	1	3	5			
Cu	10	25	69			
Fe	10	23	61			
Zn	6	19	58			
Tl	35	51	128			
Pb	11	34	91			
Cd	32	62	133			
Sn	21	69	116			
As	19	35	74			
Al	8	18	61			
Others	39	64	105			
In powder purity/%	99.98	99.96	99.91			



图 6 不同连续电解时间下铟粉微观形貌

Fig.6 SEM images of In powder with different continuous electrolysis time: (a) 1 h, (b) 3 h, and (c) 5 h







2.4 讨论

在电解过程中,化学电位比铟正的金属杂质沉积 在阳极,成为阳极泥;而化学电位比铟负的金属,若 其浓度足够低,则残留在电解液中而不至沉积在阴极。 Cu 的电位远远高于 In 的电位,因此大部分 Cu 都是以 阳极泥形式沉淀在阳极下方。对比表 2 至表 4 的数据, 不难发现,Cu 在铟微粉中的含量都在一个数量级上, 含量变化不是很明显。而且与铟电极中 Cu 含量相比, 只有不超过 70%的 Cu 进入了铟微粉中。对比表中数 据还可以发现, Fe、Zn、Al3种元素在 In 微粉中的含 量也都在一个数量级上,而且并不是 100%进入粉体 中。Fe、Zn和Al3元素的化学电位比In负得多,在 电解过程中优先放电而进入电解溶液中。这说明无论 采用哪种工艺进行电解,3种元素由于活性大而多数 存在于电解液中。粉体中沉积的3种元素的分数分别 为 Al 61%, Fe 61%, Zn 14.5%, 可见元素在粉体中沉 积多少与活泼金属的活性没有明显关系。对于镉、铊、 锡、铅这4种元素来说,由于其化学电位与铟的电位 相近,所以电解时很难除去。而且随着电解工艺参数 的改变,在铟粉体中沉积的量明显不同: In 离子浓度 越小,连续电解时间越长,电流密度越大,共沉积杂 质的量越多。其原因可能与铟枝晶状生长有关。这种 枝晶状生长,使得铟粉体具备较大的比表面积,与溶 液中杂质离子的接触机会随之增大。这些与铟粉体表 面接触的杂质离子,很容易获得电子而被还原出来, 进而沉积在铟粉体内部,造成了铟粉体杂质含量的增 加。因此,除了调整适当的工艺参数是获得纯度较高 钢粉体的条件之外,如何防止铟的枝晶生长也是获得 纯度较高粉体的条件。有资料表明^[12],添加剂明胶或 明胶和有机酸的混合物能抑制阴极上的树状结晶和结 瘤的生长。本实验中所采用的聚乙烯吡咯烷酮抑制铟 电解的枝晶及结瘤生长效果更优。

3 结 论

1) 电解法能够制备粒度小于 100 µm 铟微粉。

2)电解法制备铟微粉的最佳工艺参数为: In³⁺浓度为 30 g/L,电流密度为 130 A/cm²,连续电解时间为 1 h, NaCl浓度 80 g/L,极距 5 cm,硫脲浓度 0.3 g/L,明胶浓度 0.5 g/L,pH=2.5,添加剂聚乙烯吡咯烷酮用量为 0.2 g/L。在此工艺下制备出的铟微粉的粒度小于 30 μm 的占 75%。

3)电解法制备铟微粉的同时,能够降低铟粉中杂 质元素含量,提高铟粉纯度。经一次电解,可将铟纯 度由 99.62%提高到 99.98%。

参考文献 References

- [1] Zhang Jiuxing(张久兴), Zhang Yanfeng(张艳峰). Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与工程)[J], 2006, 35(3): 451
- [2] Chen Lin(陈林), Wu Bolin(吴伯麟). Rare Metal Materials and Engineering (稀有金属材料与工程) [J], 2007, 36(8): 1452
- [3] Takaoka G H, Yamazaki D, Matsauo J. Materials Chemistry and Physics[J], 2002, 74: 104

- [4] Liu Bingtao(刘秉涛), Jiang Anxi(姜安玺), Xu Jiaqiang(徐甲强). Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与工程)[J], 2004, 33(10): 1093
- [5] Liu Jianling(刘建玲), Lai Qionglin(赖琼琳), Chen Zongzhang(陈宗璋) et al. Journal of Functional Materials (功能材料)[J], 2005, 36(4): 559
- [6] Zhu Guisheng(朱归胜), Xu Huarui(徐华蕊), Liao Chuntu(廖 春图). Journal of Inorganic Materials (无机材料学报)[J], 2005, 20(2): 479
- [7] Wang Song(王 松), Xie Ming(谢 明), Wang Saibei(王塞北) et al. Materials Review(材料导报) [J], 2013, 27(S1): 207
- [8] Zhao Qinsheng(赵秦生). Rare Metals and Cemented Carbides(稀有金属与硬质合金) [J], 2004, 32(2): 24
- [9] Chen Jinzhong(陈进中), Wu Xiangwu(伍祥武), Wu Bozeng(吴伯增) et al. Chinese Patent(中国专利), CN201210322921.0[P]. 2012
- [10] Wang Xiaomin(王晓民), Nan Hui(南 辉), Cao Hailian(曹海 莲) et al. Chinese Patent(中国专利), CN201510114311.5[P].
 2015
- [11] Yu Limin(于丽敏), Jiang Wenquan(蒋文全), Fu Zhongzhen (傅钟臻) et al. Chinese Journal of Rare Metals(稀有金属)[J], 2012, 36(4): 617
- [12] Zhou Zhihua(周智华), Zeng Dongming(曾冬铭), Mo Hongbing (莫红兵). Chinese Journal of Rare Metals (稀有金属)[J], 2002, 26(6): 45

Effect of Electrolytic Process Parameters on the Purity and Particle Size of Indium Powder

Wang Xiaomin¹, Wang Zhixin¹, La Xuewei¹, Zhang Tingan²

 (1. Key Laboratory of Qinghai Province for Light Alloy, Qinghai University, Xining 810016, China)
 (2. Key Laboratory of Ecological Metallurgy of Multi-metal Intergrown Ores of Ministry of Education, Northeastern University, Shenyang 110819, China)

Abstract: The effect of indium ion concentration, current density and continuous electrolysis time on the purity and particle size of indium powder prepared by electrolysis process was studied. The results show that the longer the continuous electrolysis time, the larger the powder sizes, when the electric parameters are NaCl concentration 80 g/L, polar distance 5 cm, thiourea concentration 0.3 g/L, gelatin concentration 0.5 g/L, pH=2.5, and polyvinyl ketone (PVP) 0.2 g/L. Under the conditions of process parameters above with the current density of 130 A/m², the particle size of the powder is the smallest, and the purity is the highest. The effect of In ³⁺ concentration on the particle size is the slightest, but its influence on the purity is the greatest. Under the conditions of In ³⁺ concentration 30 g/L, the current density 130 A/cm², and electrolytic time 1 h, the indium with the particle size less than 100 µm can be obtained, and the particles less than 30 µm amount to 75%. Moreover, the powder purity is 99.9809%.

Key words: indium powder; electrolytic process parameter; powder size; powder characterization

Corresponding author: Wang Xiaomin, Ph. D., Associate Professor, School of Mechanical Engineering, Qinghai University, Xining 810016, P. R. China, Tel: 0086-971-5310440, E-mail: ty.com.cn@126.com